# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа прикладной математики и информатики

# Отчёт о выполнении лабораторной работы 4.3.6

Дифракция света на периодических структурах (саморепродукция)

Соболевский Федор Александрович Старокожко Иван Георгиевич Б05-111

#### Аннотация

В данной работе исследовано явление саморепродукции при дифракции света на периодических структурах. При помощи измерения параметров реподукции, а также с помощью геометрического увеличения и измерения пространственного спектра дифракции измерены параметры различных периодических структур: двумерных сеток разных размеров и миры из штриховых решёток. По точности измерений в каждом опыте выявлен наиболее точный метод измерений для каждого типа дифракционных решёток.

## Теоретические сведения

При дифракции плоской световой волны на предмете с периодической структурой наблюдается следующее явление: на некотором расстоянии от предмета вдоль направления распространения волны появляется его изображение, периодически повторяющееся при дальнейшем движении вдоль той же оси. Это явление называется *явлением саморепродукции*.

Запишем выражение для комплексной амплитуды волны, прошедшей через периодическую решётку, в плоскости, отстоящей на расстоянии z от плоскости решётки:

$$f(x,z) = \sum c_n e^{i(u_n x + \sqrt{k^2 - u_n^2}z)}.$$

Фаза n-ой плоской волны плоской волны в плоскости z= const равна  $\varphi_n=\sqrt{k^2-u_n^2}z\approx kz-\frac{zu_n^2}{2k}$ . Сравним набег фазы n-ой плоской волны с набегом фазы  $\varphi_0$  плоской волны, бегущей вдоль оси z:  $\varphi_0=kz$ . Получаем разность фаз

$$\Delta \varphi_n = \varphi_n - \varphi_0 = \frac{z}{2k} \left(\frac{2\pi}{d}\right)^2 n^2 = \pi \frac{\lambda z}{d^2} n^2. \tag{1}$$

Рассмотрим плоскость наблюдения, отстоящую от плоскости решётки на расстояние  $z_m$ , при

$$z_m = m \frac{2d^2}{\lambda}, \quad z \in \mathbb{N}. \tag{2}$$

В этой плоскости из (1) имеем разность  $\Delta \varphi_n = 2\pi m n^2$ . Получаем, что разность фаз кратна  $2\pi$  при любых целых n. Аналогично, разность фаз между любыми двумя волнами кратна  $2\pi$ :  $\Delta \varphi_{ij} = 2\pi m (i^2 - j^2)$ . Получается, что фазовые соотношения между слагаемыми плоскими волнами одинаковы в плоскости решётки и в плоскости наблюдения, откуда следует, что результат интерференции этих волн также одинаков. В этом и заключается суть эффекта саморепродукции.

## Экспериментальная установка

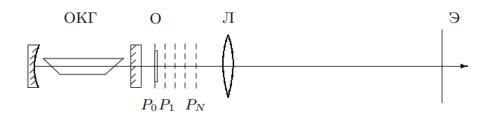


Рис. 1: Схема установки для наблюдения саморепродукции/дифракции

Хорошим приближением плоской волны в нашем эксперименте служит излучение лазера. Схема экспериментальной установки показана на рис. 1. Луч гелий-неонового лазера из генератора оптического квантового генератора (ОКГ) направляется на периодическую структуру О в плоскости  $P_0$ . В качестве В плоскостях  $P_1$ - $P_N$  возникают изображения объекта, которые с помощью линзы  $\Pi$  можно поочерёдно проецировать на экран, установленный в плоскости  $\Theta$ .

Если убрать линзу, то на экране наблюдается картина дифракции луча лазера на периодическом объекты. Экран устанавливается достаточно далеко от объекта, так что лучи, соответствующие различным порядкам дифракции ( $\sin \theta_n = n \lambda/d$ ), разделяются. Измеряя расстояние между дифракционными максимумами, можно определить  $\sin \theta_n$  и d.

В качестве периодических структур в данной работе используется мира — набор различным образом ориентированных одномерных решёток разного период, а также набор из пяти двумерных сеток-решёток. Последние можно рассматривать как пары взаимно перпендикулярных решёток.

# Ход работы, результаты

#### Определение периода решёток по их пространственному спектру

Для первого метода было измерено расстояние между дифракционными максимумами пространственного спектра. Расстояние от экрана до решетки — L=1282 мм, длина волны лазера здесь и далее —  $\lambda=532$  нм. Здесь и далее систематическая погрешность измерения длин с помощью линейки равна  $\Delta_L=1$  мм, с помощью нониусного винта линзы —  $\Delta_x=0.1$  мм.

Выразив  $\sin \theta_n$  через расстояние до экрана и до n-ого максимума, получаем следующее выражение для периода решетки:

$$d\sin\theta = m\lambda \Longrightarrow d = \frac{L\lambda \cdot N}{X_N}.$$

Измерения данным методом были проведены для всех двумерных решёток (1-5). Результаты представлены в таблице 1. Погрешность в данном эксперименте можно считать зависящей в основном от систематической.

$N_{\overline{0}}$	N	$X_N$ , mm	$x_0$ , MM	d, cm
1	6	204	34,0	$0,020\pm0,003$
2	4	81	20,3	$0,034\pm0,005$
3	13	148	11,4	$0,0600\pm0,003$
4	15	90	6,0	$0,114\pm0,004$
5	35	150	4,3	$0,159\pm0,006$

Таблица 1: Результаты измерения периодов решёток по пространственному спектру

# Определение периода решеток по изображению, увеличенному с помощью линзы

Для второго метода в схему была добавлена собирающая линза, создающая увеличенное изображение на экране. При помощи проволчки, то есть непериодического объекта, найдено первое изображение. Размеры изображений могут быть найдены из формулы увеличения:

$$d = D\frac{a}{b},$$

где a — расстояние до линзы, b — до экрана. Результаты измерения периодов представлены в таблице 2. Здесь вклад в погрешность вносит также усреднение при расчёте D. Также отметим,

что в силу мелкости картины не удалось измерить период данным способом для решёток 1 и 2.

$N_{\overline{0}}$	$X_N$ , MM	$x_0$ , MM	d, cm
3	51	1,8	$0,089\pm0,012$
4	49	2,9	$0,140\pm0,018$
5	41	3,2	$0,153\pm0,022$

Таблица 2: Результаты измерения периодов решёток по геометрическому изображению

#### Исследование эффекта саморепродукции с помощью сеток

Далее для каждой решетки измерена зависимость координаты саморепродуцированного изображения от его номера. По коэффициенту зависимости можно найти период решетки:

$$d = \sqrt{\frac{k\lambda}{2}}$$

Результаты представлены в таблице 3. Здесь в погрешность измерений входит случайная ошибка метода наилучшей прямой. Графики зависимостей изображены на рис. 2 (там же изображены графики для решёток миры, см. далее).

$N_{\overline{0}}$	0	1	2	3	4	5	6	k, мм	d, см
3	37,45	41,2	44,1	48,2	50,7	54,95	56,3	3,24	$0,093\pm0,011$
4	37,2	42,05	50,65	57,375	64,1	-	-	6,91	$0,136\pm0,016$
5	37,6	48,45	-	-	-	-	-	10,85	$0,170\pm0,035$

Таблица 3: Результаты измерения периодов решёток по репродукции

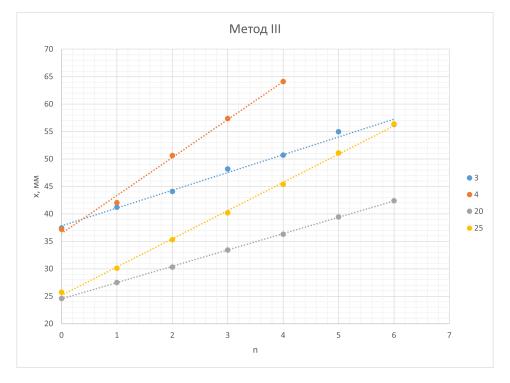


Рис. 2: Графики зависимости для метода саморепродукции

Решетка	1	2	3	4	5
Метод I	$0,020\pm0,003$	$0,034\pm0,005$	$0,060\pm0,003$	$0,114\pm0,004$	$0,159\pm0,006$
Метод II	-	-	$0,089\pm0,012$	$0,140\pm0,018$	$0,153\pm0,022$
Метод III	-	-	$0,093\pm0,011$	$0,136\pm0,016$	$0,170\pm0,035$

#### Результаты измерения решеток

Сводка результатов измерений в таблице ниже.

Можно заметить, что наиболее крупная решетка имеет наиболее близкие друг к другу результаты, в то время, как значения для остальных отличаются при вычислении разными методами. Численная погрешность меньше всего при измерениях первым методом. Отметим, что первый метод также оказался единственным, применимым для измерения периодов мелких решеток.

#### Исследование миры

В установку предыдущего пункта вместо кассеты с решетками вставлена мира. Аналогичным образом, тремя методами измерены параметры решетки №25, затем №20. Поскольку все вычисления совершенно аналогичны предыдущим пунктам, приведём лишь результаты.

Решётка миры	№20. d, см	№25. d, см
Метод I	$0,039\pm0,004$	$0,051\pm0,005$
Метод II	$0,049\pm0,008$	$0,063\pm0,012$
Метод III	$0,089\pm0,013$	$0,117\pm0,017$

Заметим, что результаты последнего метода сильнее всего отличаются от остальных. Погрешность измерений так же, как и в опытах с решёткам, оказалась наименьшей при измерении параметров простраственного спектра.

## Выводы

В работе мы изучили саморепродукцию и применили его к измерению периодов дифракционных решеток. Параметры данных периодических структур измерены двумя дополнительными методами (по спектру и по увеличенному изображению через линзу). Дополнительные методы измерения дали совпадающие по порядку результаты, однако сходятся сточностью до коэффициента с остальными методами. Результаты измерений и их сравнение представлены в таблицах выше.

Явления саморепродукции позволило довольно точно оценить параметры решёток по порядку величины, однако наиболее результативным оказался метод измерения пространственного спектра.